دراسة تأثير التلدين على بعض الخواص البصرية لغشاء (ZnS 70: Cu 30) الرقيق

زهیر ناجی مجید

قسم الفيزياء ، كلية النربية ، جامعة نكريت ، نكريت ، العراق (1 / 2013 / 4 / 2013) و تاريخ الاستلام: (2 / 2 / 2013)

الملخص

تم في هذا البحث دراسة تأثير التلدين على بعض الخواص البصرية لأغشية كبريتيد الخارصين (ZnS)المشوب بنسبة 30%من النحاس والمحضر بطريقة الرش الكيميائي الحراري وبدرجة حرارة °C (400) وبسمك (°1000)وقد تم أيضا تلدين الغشاء المحضر لمدة ساعة واحدة بدرجة (450°). وأظهرت نتائج الفحوصات البصرية إن الخواص البصرية (الانعكاسية ومعامل الامتصاص ومعامل الانكسار) قد زادت قيمتها بعد التلدين حيث كانت قيمة الانعكاسية هي (0.0089) فأصبحت بعد التلدين (0.0186) وقيمة معامل الامتصاص فكانت (0.172cm¹) فأصبحت (0.211cm¹) أما قيمة معامل الانكسار فكانت (1.209) فأصبحت (1.316) بينما (فجوة الطاقة) قلت بسبب التلدين حيث كانت قيمتها (3.93eV) فأصبحت قيمتها (3.87eV) فأصبحت قيمتها

المقدمة النظرية

تعد تقنية الاغشيه الرقيقة واحده من أهم التقنيات التي ساهمت في تطوير المواد شبه الموصلة وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خصائصها الفيزيائية[1]. آذ تحظى الأغشية الرقيقة باهتمام اكبر لاستخدامها ضمن مجالات متعددة حيث تدخل في تصنيع العديد من مكونات الأجهزة الالكترونية الرقيقة والكواشف (Detectors) مكونات الأجهزة الالكترونية الرقيقة والكواشف للمجالات البصرية كتصنيع المرايا والألواح الزجاجية الحساسة للموجات الكهر ومغناطيسية.كذلك تدخل في صناعة الدوائر الكهربائية الدقيقة[2] الكهر ومغناطيسية الرقيقة خواصا ومميزات قد لاتكون موجودة في أشكال المادة الأخرى حيث سمكها المتناهي في الصغر منحها تركيبا فيزيائيا ندارا يقترب من صفات التركيب أحادي التبلور وقد يتفوق عليه أحياناءإذ أن الأغشية الرقيقة للمادة يختلف تركيبها البلوري عن تركيب المادة بشكلها الاعتيادي بجملة نقاط منها[3]:-

1- أن حجم البلورات في الأغشية الرقيقة اصغر من حجمها الطبيعي في المادة

2- يمكن أن تحتوي الأغشية الرقيقة على شوائب أعلى بكثير مما في المادة بشكلها الطبيعي ناتجة من طريقة التحضير.

S- العيوب النقطية في الأغشية الرقيقة تكون أكثر مما في بلورات المادة الطبيعية خصوصا في درجات حرارة أعلى من OK° بسبب الحركة الاهتزازية حيث تهتز ذرات المادة في مواقعها محدثة عيوب نقطية.

إن فيزياء الحالة الصلبة هي احد العلوم المهمة التي تعنى بدراسة الخواص الفيزيائية المختلفة للمواد الصلبة التي تشمل الأواصر وترتيب الذرات واستقطاب الجزيئات وتصرفات الالكترونات الحرة والطليقة في المادة بالإضافة إلى الخواص الكهربائية للمواد النقية وتلك التي تحتوي على شوائب، إضافة إلى الخواص المغناطيسية والميكانيكية للمواد في درجات حرارية واطئة و تترتب ذرات المواد الصلبة على هيئة وحدات هندسية أولية تعيد نفسها بانتظام ضمن فضاء الجسم الصلب، وتبعا لدرجة الانتظام فان المواد الصلبة توجد بإشكال عديدة تتراوح في العادة

بين أحادية البلورة (single crystal) التي تمثل أعلى درجة انتظام والعشوائية (Amorphous) التي تفتقر الى الانتظام البلوري. إن الخصائص البصرية للمواد الصلبة تعتمد على توزيعات الالكترونات في ذراتها وبالتالي فهي تعتمد على طريقة ترتيب وانتظام الذرات، لذا فان من متطلبات فهم هذه الخصائص ودراستها تحديد علاقتها بالخصائص التركيبية للمواد الصلبة بشكل عام وأشباه الموصلات بشكل خاص[4]. وتتاثر المواد شبه الموصلة بالحرارة والضوء والمجال المغناطيسي فضلا عن تأثير الشوائب، ونتيجة لحساسية المواد شبه الموصلة بهذه العوامل فقد أصبحت من المواد البالغة الأهمية في التطبيقات المختلفة [5].

المركب المستخدم في هذا البحثZnS:

كبريتيد الخارصين يعود الى المجموعتين (II-VI)من اشباه الموصلات وهو مركب مهم حيث يستخدم في الخلايا الشمسيه والتطبيقات الكهروبصريه الاخرى.[6]وهو احد مركبات الكبريتيد المعدنيه عباره عن مسحوق ابيض شفاف يتكون من تركيبتين بلورتين هما (Wurtzite)و (βZincblend)يتغير الى طور αعند درجة حراره(αWurtzite)عند الضغط الجوي الاعتيادي ولا يذوب نهائيا طالما ان درجة التسامي له تكون واطئه ويتحلل في الحوامض ولا يحل في الماء كما انه قليل السميه [7]ويستعمل ZnSركيزه معدنيه لوليه لاستخراج الزنك الذي يكون شفاف او نصف شفاف بلون اصفر ولان ZnSو كاكتظهران حساسيه نحو المغناطيسيه والكهربائيه والاشعاع الجسيمي فقد استعملت بشكل واسع في الالاكترونيات وبتشويبها مع عناصراخرى تصبح مضيئه (Luminescent) ولهذا فالمركب يعتبر من الموادالمهمه في صناعه الدايود الباعث للضوء الازرق [8].

التلدين

يقصد بعملية التلدين تعريض العينة (الغشاء الرقيق) الى درجة حرارة ($^{\circ}$ 450 $^{\circ}$) ولمدة ساعة واحدة وقد أجريت عملية التلدين باستخدام فرن كهربائى ألمانى المنشأ (Maxi –Centurion – Germany)

بعض الثوابت البصرية التي تم دراستها في هذا البحث

1- الانعكاسية Reflectance

يمكن تعريف الانعكاسية بنسبة مقدار الطاقة التي تنعكس إثناء سقوط الشعاع على سطح الغشاء الرقيق الى مقدار طاقة الشعاع الساقط[9]. وتم حساب الانعكاسية وذلك من قانون حفظ الطاقة.

$$A+T+R=1$$
....(1)
 $R=1-A-T$(2)

(Energy Gap) فجو ة الطاقة -2

تعرف فجوة الطاقة بأنها الطاقة اللازمة لإثارة (نقل) الالكترونات من قمة حزمة التكافؤ الى قعر حزمة التوصيل، أو هي فسحة الطاقة الموجودة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل، وقد سميت بالمحظورة أو الممنوعة لأنها مكان خالي تقريبا من المستويات ولا تستقر فيها الالكترونات في اشباه الموصلات النقية وا إنما تتواجد فيها لفترة زمنية قصيرة جدا في اشباه الموصلات المشوبة وهذه الفجوة تحدد نوع المادة الصلبة وتم حساب قيمة فجوة الطاقة باستخدام المعادلة الآتية [10]

$$(\alpha h v) = A (hv-Eg)^r$$
 -----(3)

- معامل الامتصاص hv – طاقة الفوتون $-\alpha$: حيث ان $-\alpha$ المتصاص $-\alpha$ الطاقة $-\alpha$ – مقدار اسي

وبتربيع المعادلة نحصل على هذه المعادلة

$$(\alpha h \nu)^2 = A^2 (h\nu - Eg)$$
 -----(4)

حيث ان قيمة r هي ½ وهذه القيمة تدل على ان الانتقالات الاكترونية هي من النوع المباشر المسموح .

Absorption Coefficient معامل الامتصاص -3

يعرف معامل الامتصاص والذي يرمز له بالرمز (α) بأنه نسبة النقصان في فيض طاقة الإشعاع بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط [11]. ويعتمد على طاقة الفوتونات والطول ألموجي وكذلك طبيعة سطح الغشاء الرقيق وفجوة الطاقة لشبه الموصل وكذلك نوع الانتقالات الالكترونية التي تحدث بين حزم الطاقة و و تم حساب معامل الامتصاص من العلاقة [11].

 α =2.3031A/t ..(5)

حيث إن α: معامل الامتصاص : t: سمك الغشاء : A: المتصاصبة

Refractive index الانكسار 4

وهو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الى سرعته في الوسط [13] وتم حساب معامل الاتكسار من العلاقة الاتية [14] .

no =
$$[(1+R/1-R)^2 - (K_{\circ} + 1)^2]^{1/2}$$
 --(6)

الجانب العملي

لتحضير محلول ZnS تستخدم نترات الخارصين ZnS الحاوية على ZnS الحاوية على ZnS (NO_3)6 H_2O (NO_3)6 H_2O (ZnS) ويذوب بحجم مناسب من الماء المقطر فيصبح المحلول مصدر لايونات الخارصين ZnS أما مصدر ايونات الكبريت ZnS0 فنحصل عليه من مادة الثايوريا ZnS10 (Zn2) ويمزج المحلولين بنسب متساوية وحسب المعادلة الآتية:

 $Zn(NO_3)_2 + (SCNH_2)_2 + 3H_2 \rightarrow ZnS + 2NH_4NO_3CO_2 + H_2O \quad . \quad (7)$

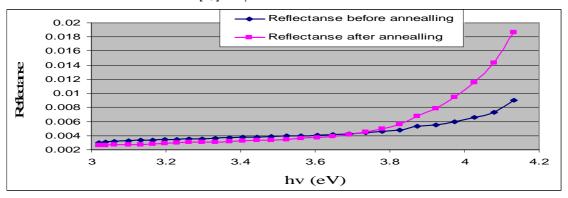
ومن ثم مزج الخليط مزجاً جيداً باستخدام خلاط مغناطيسي Magnetic Stirrer من عدم وجود راسب للمادة ومن ثم يتم ترشيح المحلول ساعة للتأكد من عدم وجود راسب للمادة ومن ثم يتم ترشيح المحلول عبر ورقة ترشيح فنحصل على محلول رائق متجانس بعياريه (0.1) آما مادة التشويب فقد تم إذابة نفس الكمية من نترات النحاس (1.4)gm وهي حبيبات زرقاء اللون مع (100) من الماء المقطر ومن ثم وضعها على الخلاط المغناطيسي لمدة mi(30) ثم يترك لمدة ساعة للتأكد من عدم وجود رواسب للمادة ثم ترشح وتخلط نسب من المادة الشائبة مع محلول ZnS بالمقدار الأتي :30:70نسبة التشويب .

النتائج والمناقشة

تم دراسة النتائج على ضوء القيم التجريبية التي تم الحصول عليها بواسطة جهاز (UV) لقيم الامتصاصية والنفاذية و تم إيجاد قيم الانعكاسية وفجوة الطاقة و معامل الامتصاص ومعامل الانكسار كلها كو ال لطاقة الفوتون.

Reflectance - الانعكاسية

تم حساب الانعكاسية من طيف الامتصاصية والنفاذية باستعمال العلاقة(2) ويظهر الشكل (1) تغير الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون حيث نلاحظ ان الانعكاسية تزداد بعد التلدين وسبب ذلك يعود إلى زيادة تبلور المادة وتقليل العيوب البلورية وهذه النتيجة تقارب نتيجة البلحث [15].

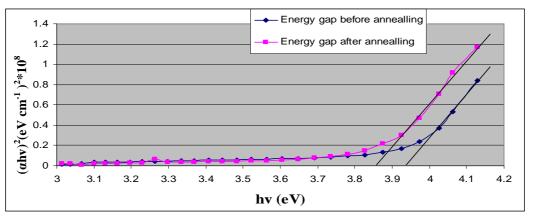


الشكل رقم (1) الانعكاسية قبل ويعد التلدين

(Energy Gap) فجوة الطاقة -2

لغرض حساب فجوة الطاقة تم استخدام العلاقة (4) فقد تم رسم العلاقة البيانية بين ² (α hυ) وطاقة الفوتون (hυ) لتعين فجوة الطاقة ويتضح من الشكل (2) قيمة فجوة الطاقة حيث كانت قيمتها (3.875eV) قبل التلدين وأصبحت قيمتها بعد التلدين (3.875eV) ويتبين لنا إن التلدين أدى الى نقصان قيمة فجوة الطاقة وتفسير هذا

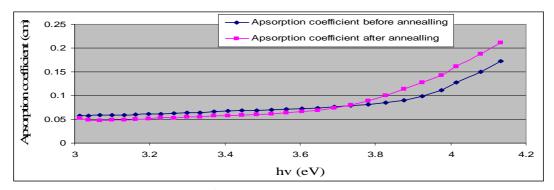
النقصان هو ان الحرارة أدت الى توليد مستويات طاقة إضافية ضمن الفجوة المحظورة وبالقرب من حزمة التوصيل .مما يؤدي الى تقليل طاقة الفوتون المطلوبة لحصول الانتقالات الالكترونية المباشرة مما يجعل انتقال الالكترونات من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل أسهل وهذه النتيجة تقارب نتيجة الباحث [17–16].



الشكل رقم (2) فجوة الطاقة قبل وبعد التلدين

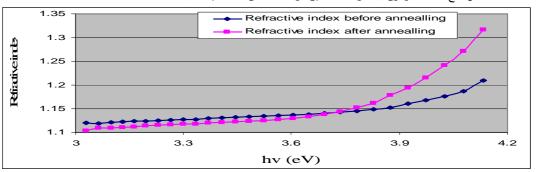
3- معامل الامتصاص من العلاقة (5) والشكل (3) يمثل تم حساب معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون قبل وبعد التلدين ونلاحظ

من الشكل ان التلدين أدى الى زيادة معامل الامتصاص بسبب تولد مستويات مانحة داخل فجوة الطاقة قريبة من حزمة التوصيل وهذه النتيجة تقارب نتيجة الباحث [18].



الشكل (3) معامل الامتصاص قبل وبعد التلدين

4- معامل الانكسار Refractive index الشكل ان التلدين أدى الى زيادة معامل الانكسار وقد يعزى ذلك الى تم حساب معامل الانكسار من العلاقة (6) والشكل (4) يمثل تغير اختلاف طبقة سطح الغشاء وتأثير الحرارة عليها وهذه النتيجة تقارب معامل الانكسار مع طاقة الفوتون قبل وبعد التلدين ونلاحظ من التنجة الباحث [18].



الشكل (4) معامل الانكسار قبل وبعد التلدين

2- التلدين ادى الى نقصان فجوة الطاقة .

3- التلدين ادى الى زيادة في قيم الانعكاسية ومعامل الامتصاص ومعامل الانكسار.

- 12- R. S. Longhrst. "Geometrical and Physical Optics" Longman Group. L T D . London -2^{nd} Ed. (1976)
- 13- M . H . Suleiman & A. F . Basha. " The Solid Physics " . 1^{st} Ed . Egypt (2000) .

14- ريما عبد العزيز عبدالله . "دراسة الخواص البصرية لغشاء ZnO المشوب بالفضة " . رسالة ماجستير . كلية العلوم الجامعة المستصرية (2002) .

15- محمد شريف محمد علي الجواري. "راسة تأثير التشويب بالنيكل على الخواص البصرية والتركيبية لأغشية كبريتيد الخارصين ZnS النقي المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري ". رسالة ماجستير. كلية التربية جامعة تكريت (2009).

- 16- G.Nabiyouni , R.Sahraei, M.Toghiany , M. H. Majles Ara and K.Hedayati. " Preparation and Characterization of nano structured ZnS thin films grown on glass and N-type si substrates using a new chemical bath deposition technique " Rev.Adv.Mater. Sci.27(2011)52-57 .
- 16- Dong. H. Wang, Jang. H. Ann, Kwun. N. Hui, Kwun. S. Hui and Young. G. Son "Structural and optical properties of ZnS thin films deposited by RF magnetron sputtering " nano scalereslett . Research letters . 2012, 7: 26

17- خالد حمادة ياسين "دراسة تأثير التشويب بالنحاس على بعض الخواص البصرية والتركيبية لأغشية ZnS الرقبقة والمحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري" رسالة ماجستير .كلية التربية جامعة تكريت (2009).

الاستنتاحات

1- ان غشاء (ZnS) الرقيق يمتلك فجوة طاقة تبلغ (ZnS) للانتقال المبشر المسموح.

المصادر

- 1- Chopra, K.L." Thin film Phenomena", London McGraw Hill (1969).
- 2- Smith R.A." Semiconductors", 2nd Edition (Cambridge University press) (1989)
- 3- Leaver. K.D. " Thin Film," London Wykeham Publication (LTD) (1971).
- 4-S.S.AL-Rawi, "Solid State Physics" (1988).
- 5- A .K. Abass, "Solar Energy Materials", Vol.10, (1988).
- 6- Sapra Sameer, Nanda. J and Sarma. D.D "Semiconducting Nanoparticales" Solid state and, structural chemistry unit institute of science Bangolar -560012, India (2002).
- 7- Berry. R.W, Hall .P.M and Harris .T , Thin Film Technology, Litton Education Publishing. New Yourk (1969).
- 8- M.S. Shinde, P.B. Ahirrao, I.J. Patil & R.S. Patil "Studies on nanocrystalline ZnS thin films prepared by modified chemical bath deposition methode "Indian Journal of pure&Applied physics .Vol.49,November2011,pp.765-768.

9- أسيل صبحي جاسم الحسني ، "تحضير ودراسة خواص أغشية Te & Cd المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري"، رسالة ماجستير، الجامعة ألتكنولوجيه (2004).

-10 صابر جاسم محمد . "دراسة الخواص التركيبية والبصرية لغشاء pbs ولغشاء ZnS » رسالة ماجستير . كلية التربية جامعة تكريت (2005) .

11- Jacques I. Ponkove ,, Optical Processes in Semiconductors Dove Publications Inc ., New York , (1975).

Study the effect of annealing on some optical properties of (ZnS) thin films dopped with 30% cu concentration

Zuheer Naji Majeed

Department of Physics, College of Education, Tikrit University, Tikrit, Iraq (Received: 19 / 2 / 2013 ---- Accepted: 4 / 4 / 2013)

Abstract

In this search we study the effect of annealing on some optical properties of (ZnS) thin films dopped with copper which prepared by Chemical Spray Pyrolsis method at $(400C^\circ)$, thickness $(1000A^\circ)$, and we sintering the prepared films at temperature $(450C^\circ)$ for (1 hour). The results show that the optical properties such as (Reflectance , Absorption Coefficient and Refractive index) increases after annealing . The Reflectance was increased from (0.0089) to (0.0186) and Absorption Coefficient increased from (0.172cm^{-1}) to (0.211cm^{-1}) and Refractive index increased from (1.209) to (1.316) while the (energy gap) decreased after annealing from (3.93eV) to (3.87eV).